

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore™**
RELEASE 1.4Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links**

» S

Welcome to IEEE Xplore® Your search matched [0] of [792573] documents.

- [○- Home](#)
- [○- What Can I Access?](#)
- [○- Log-out](#)

Tables of Contents

- [○- Journals & Magazines](#)
- [○- Conference Proceedings](#)
- [○- Standards](#)

Search

- [○- By Author](#)
- [○- Basic](#)
- [○- Advanced](#)

Member Services

- [○- Join IEEE](#)
- [○- Establish IEEE Web Account](#)

 [Print Format](#)

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2002 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)**IEEE Xplore™**
RELEASE 1.4Welcome
United States Patent and Trademark Office[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)**Quick Links**

>> S

Welcome to IEEE Xplore®

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

Tables of Contents

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

Search

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

Member Services

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)

[Print Format](#)Your search matched **1 of 792573** documents.Results are shown **15** to a page, sorted by **publication year** in **descending order**.You may refine your search by editing the current search expression or entering a new one in the text box. Then click **Search Again**.**Results:**Journal or Magazine = **JNL** Conference = **CNF** Standard = **STD****1 An experimental Japanese/English interpreting video phone system**

Karaorman, M.; Applebaum, T.H.; Itoh, T.; Endo, M.; Ohno, Y.; Hoshimi, M.; T.; Matsui, K.; Hata, K.; Pearson, S.; Junqua, J.-C.

Spoken Language, 1996. ICSLP 96. Proceedings., Fourth International Conference , Volume: 3 , 1996

Page(s): 1676 -1679 vol.3

[\[Abstract\]](#) [\[PDF Full-Text \(416 KB\)\]](#) **CNF**

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2002 IEEE — All rights reserved

[IEEE HOME](#) | [SEARCH IEEE](#) | [SHOP](#) | [WEB ACCOUNT](#) | [CONTACT IEEE](#)



[Membership](#) [Publications/Services](#) [Standards](#) [Conferences](#) [Careers/Jobs](#)

IEEE Xplore™
RELEASE 1.4

Welcome
United States Patent and Trademark Office

[Help](#) [FAQ](#) [Terms](#) [IEEE Peer Review](#)

Quick Links

» Adv

Welcome to IEEE Xplore®

- [Home](#)
- [What Can I Access?](#)
- [Log-out](#)

Tables of Contents

- [Journals & Magazines](#)
- [Conference Proceedings](#)
- [Standards](#)

Search

- [By Author](#)
- [Basic](#)
- [Advanced](#)

Member Services

- [Join IEEE](#)
- [Establish IEEE Web Account](#)

- 1) Enter a single keyword, phrase, or Boolean expression.
Example: acoustic imaging (means acoustic and imaging)
- 2) Limit your search by using search operators and field codes, if desired.
Example: optical <and> (fiber <or> fibre) <in> ti
- 3) Limit the results by selecting Search Options.
- 4) Click Search. See [Search Examples](#)

text-to-speech and local
and remote



Start Search

Clear

Note: This function returns plural and suffixed forms of the keyword(s).

Search operators: <and> <or> <not> <in> [More](#)

Field codes: au (author), ti (title), ab (abstract), ct (conference title), jn (journal name) [More](#)

Search Options:

Select publication types:

- Journals
- Conference proceedings
- Standards

Select years to search:

From year: to

Organize search results by

Sort by:
In: Descending order
List 15 Results per pag

[Home](#) | [Log-out](#) | [Journals](#) | [Conference Proceedings](#) | [Standards](#) | [Search by Author](#) | [Basic Search](#) | [Advanced Search](#)
[Join IEEE](#) | [Web Account](#) | [New this week](#) | [OPAC Linking Information](#) | [Your Feedback](#) | [Technical Support](#) | [Email Alerting](#)
[No Robots Please](#) | [Release Notes](#) | [IEEE Online Publications](#) | [Help](#) | [FAQ](#) | [Terms](#) | [Back to Top](#)

Copyright © 2002 IEEE — All rights reserved